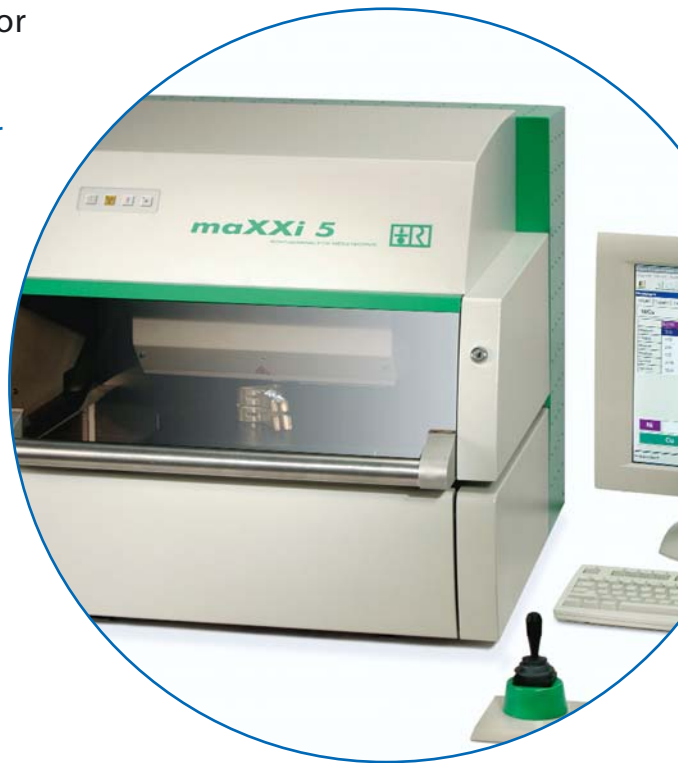


maXXi 5/PIN

Röntgenfluoreszenz Analysator
mit Halbleiterdetektor
X-ray Fluorescence Analyser
with Semiconductor Detector



Universeller
Röntgenfluoreszenz-
Material- und
Schichtanalysator
für alle Arten
von Proben

A universal X-ray
material and coating
thickness analyser
designed for a large
variety of sample sizes

Das maXXi 5/PIN ist der universelle Material- und Schichtdickenanalysator zu einem günstigen Kosten-Nutzenverhältnis. Durch die Verwendung eines hochauflösenden Silizium-Halbleiterdetektors ist das maXXi 5/PIN ein ideales Messsystem für Anwender, die beste Nachweisgrenzen und höchste Genauigkeit fordern. Die hohe Detektorauflösung und das bessere Signal-/Untergrundverhältnis macht die Analyse und Vermessung dünner, komplexer Beschichtungen, z.B. an Solarpanels, ohne Probleme möglich. Die große, geschlitzte Probenkammer ist sowohl für großflächige Proben wie Leiterplatten als auch für kleine Präzisionsteile wie Kontakte geeignet. Unterschiedliche Probestische ermöglichen die Anpassung des maXXi 5/PIN an jeden Kundenwunsch. Die umfangreiche Auswertesoftware des maXXi 5/PIN ermöglicht die Analyse von Feststoffen (ab Z = 20/Ca), Flüssigkeiten sowie Mehrfach-Legierungsbeschichtungen. Damit ist das maXXi 5/PIN ein ideales Universalgerät für die Qualitätskontrolle, Wareneingangsprüfung und das Analysenlabor.

The maXXi 5/PIN offers a universal material and coating thickness analyser at a reasonable price/performance ratio. The use of a high resolution Silicon semiconductor detector makes the maXXi 5/PIN an ideal tool for users who want to have best limits of detection and the highest precision. The better detector resolution together with a higher signal-to-noise ratio allows the analysis of thinner, complex coatings, like for instance on solar panels. The large, slotted sample chamber is suitable for a large range of parts, from printed circuit boards to small precision parts like contacts. A variety of sample stages allows the adaptation of the maXXi 5/PIN to customers needs and budgets. A very comprehensive library of software tools allows the analysis of bulk as well as liquid samples (from Z = 20/Ca). Multiple layer alloy coatings on complex base materials can be analysed as well. This makes the maXXi 5/PIN the ideal universal tool for quality control, incoming inspection and the laboratory.



锦贤科技
GENESEEA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934

网站: www.gene-sea.com

邮箱: genesea@126.com

Q Q: 510244122 32174454

maXXi 5/PIN

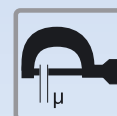
Röntgenfluoreszenz Analysator mit Halbleiterdetektor X-ray Fluorescence Analyser with Semiconductor Detector

Technische Daten	
HV-Generator	25 - 50 kV, max. 1.2 mA, programmierbar
Röntgenröhre	Mikrofokusröntgenröhre mit dünnem Glasfenster, W-Target, Spot 0.1 x 0.1 mm
Röhrenleistung (Option)	25 - 50 kV, max. 50 VA, applikationsoptimiert Be-Fenster Mikrofokusröhre, 85 x 85 µ, nur in Verbindung mit Filterwechsler
Einfachkollimator	0.3 oder 0.5 mm Ø
Kollimatorwechsler (Option)	0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm Ø oder nach Kundenwunsch
Probentisch	motorisiert und programmierbar a.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, easy load, 0.1 mm Genauigkeit, 5 kg Probengewicht b.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, easy load, 0.02 mm Genauigkeit, 5 kg Probengewicht c.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, 0,02 mm Genauigkeit, max. 20 kg Probengewicht
Probenpositionierung	Joy Stick, Point & Shoot, Laser, Autofokus
Videosystem	Farbkamera mit Fadenkreuz, 2-fach Zoom, Vergrößerung ca. 40- bzw. 80fach
Detektorsyste	Peltier-gekühlter Silizium-Halbleiterdetektor (PIN-Diode), 25 mm ² Fläche, Dicke 0.5 mm, Be-Eingangsfenster 25 µ dick, Auflösung ca. 300 eV
Strahlenschutz	Vollschutzgerät nach RöV § 4
Abmessungen	H = 67 cm, B = 70 cm, T = 75 cm
Probenraum	Nutzbar H = 35 cm, B = 60 cm, T = 50 cm, geschlitzte Probenkammer
Netzanschluss	110/230 Volt, 50/60 Hz
X-MasteR Software	Betriebssystem unter Windows 2000 und XP
µ-MasteR	Auswertemodul für Schichtdickenmessung (Mehrlagen und Legierung)
FunMasteR	Kalibriermodul zum Erstellen von Messaufgaben nach Fundamentalparametern
ElementMasteR	Qualitative Materialanalyse von bis zu 20 Elementen mit No-Stand. Quantifizierung
%-MasteR	Quantitative Materialanalyse mit Standards nach Lucas-Tooth
LiquidMasteR	Auswertemodul für Flüssigkeiten (Galvanikbäder)
DataMasteR	Artikel-Verwaltung und Langzeitstatistik
ReportMasteR	Modul zur Reporterstellung

(Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden)

Technical Data	
HV Generator	25 - 50 kV, max. 1.2 mA, programmable
X-ray tube	Microfocus X-ray tube with thinned glass window, tungsten target, spot 0.1 x 0.1 mm
X-ray power (option)	25 - 50 kV, max. 50 kVA, application depending optimised Be-window microfocus tube, 85 x 85 µ spot, (only in conjunction with filter changer)
Single collimator	0.3 or 0.5 mm Ø
Collimator changer (option)	Four positions, programmable and motorised 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm Ø or customer specific
Sample stage	motorised and programmable a.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, easy load, 0.1 mm precision, 5 kg sample weight b.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, easy load, 0.02 mm precision, 5 kg sample weight c.) X = 300, Y = 250, Z = 180 mm, 0.02 mm precision, max. 20 kg sample weight
Sample positioning	Joy stick, point & shoot, laser, autofocus
Video system	Colour TV camera with 2 x zoom, electronic crosshair, magnification approx. 40/80 x
Detector system	Peltier cooled Silicon semiconductor detector (PIN-diode), 25 mm ² active area, 0.5 mm thick, Be-entrance window, 25 µ thick, energy resolution approx. 300 eV. fully protected, fail safe system according to the German X-ray laws (RöV)
Radiation safety	
Chamber	H = 67 cm, B = 70 cm, T = 75 cm
Sample Chamber	usable H = 35 cm, B = 60 cm, T = 50 cm, slotted sample chamber
Mains supply	110/230 Volt, 50/60 Hz
X-MasteR Software	Operating software under Windows 2000 or XP
µ- MasteR	Evaluation module for coating thickness measurement (multi layers and alloys)
FunMasteR	Calibration module to create applications using fundamental parameter calculations
ElementMasteR	Qualitative material analysis up to 20 elements with No-standard quantification
%-MasteR	Quantitative material analysis with standards using the Lucas-Tooth model
LiquidMasteR	plating bath analysis
DataMasteR	Data base and long term statistics for process control and documentation
ReportMasteR	Report generator for user defined customised reports

(Technical specification can change without notice)



锦贤科技
GENESEEA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934

网站: www.gene-sea.com

邮箱: genesea@126.com

QQ: 510244122 32174454